

令和元年 7 月 22 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 柿本 浩一

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 164 回研究会 開催通知

日時： 2019 年 8 月 30 日 (金) 13:00 ~ 17:30
会場： 明治大学 駿河台キャンパス 大学会館 第 3、4 会議室
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545)
JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分
東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分
都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ 「放射線を用いた先端計測技術：

— 見えない光でもものを見る、検出器開発から応用研究まで —

世話人：志村考功 (大阪大学)、表 和彦 (リガク)、廣沢一郎 (高輝度光科学研究センター)

プログラム

- 13:00~13:05 開会の挨拶 九州大学 柿本 浩
—
13:05~13:10 はじめに 大阪大学 志村考功
13:10~13:50 「Silicon-On-Insulator 基板を用いた量子線イメージ検出器の開発」
高エネルギー加速器研究機構 新井康夫
13:50~14:30 「非冷却赤外線イメージセンサの最新動向」
立命館大学 木股雅章
14:30~15:10 「イメージセンサにおける暗電流・白傷の低減」
兵庫県立大学/静岡大学 寺西信一
15:10~15:25 休憩
15:25~16:05 「X 線非弾性散乱によるバルク SiGe (x=0.72) 単結晶のフォノン分散測定」
東芝メモリ (株) 臼田宏治
16:05~16:45 「X 線散乱法を用いたナノスケール周期パターンの表面形状計測」
(株) リガク 伊藤義泰
16:45~17:25 「赤外放射光を利用した分析測定について」
高輝度光科学研究センター 池本夕佳
17:25~17:30 おわりに 高輝度光科学研究センター 廣沢一郎
17:30~17:50 委員総会
18:00~20:00 意見交換会(明治大学駿河台キャンパス 大学会館 第 1 会議室)

以上